

多目的X線回折装置 (XRD)



メーカー	株式会社リガク
型式	SmartLab
概要	半導体や金属材料等の結晶構造・欠陥構造の解析、粉末試料の構成成分の同定や結晶化度の解析ができる装置です。各種オプションによる応用分析の事例としては、逆格子マップ測定や高分解能ロッキングカーブ測定、小角散乱測定等が挙げられます。元素分析ではなく化合物として解析でき、また同じ化学式でも結晶構造が異なる多形区別ができることが特徴です。
仕様	最大定格出力：9kW (45kV、200mA、Cuターゲット) 制御ソフトウェア：SmartLab Guidance
オプション	<p><入射側> CBOユニット、CBO-fユニット Soller_slit(Open, 5.0, 2.5deg)In-Plane PSC(0.5, 0.15deg) モノクロメータ (Ge(220)×2, Ge(220)×4)</p> <p><アタッチメント> 標準, RxRy, XY-20, XY-4</p> <p><試料板> アルミ試料ホルダー、ガラス試料ホルダー、無反射試料板、透過小角用試料板</p> <p><受光側> Soller_slit(5.0, 2.5deg) PSA(Open, 0.5, 0.228, 0.114deg 全てIn-Planeも可) 2結晶アナライザ (Ge(220)×2)、Vacuum Path</p> <p><検出器> シンチレーションカウンタ (DBMユニット有) D/teX Ultra (1次元検出器)</p>
利用条件	粉末試料測定時の微粉末化や試料の切り出し等、測定前の試料準備は予め実施の上ご持参ください。
設置場所	地域産学連携研究センター 装置室C
利用料	4,290円/時間 (税込)
連絡先	予約、利用相談は電話又はメールにてお問い合わせください。 044-934-7250 (内線7250) cii●mics.meiji.ac.jp (●の部分を@に置き換えてお送りください)